

# BREVET D'INVENTION

## **CERTIFICAT D'UTILITÉ - CERTIFICAT D'ADDITION**

# **COPIE OFFICIELLE**

Le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle certifie que le document ci-annexé est la copie certifiée conforme d'une demande de titre de propriété industrielle déposée à l'Institut.

Fait à Paris, le 2 6 JUIL 2004

Pour le Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle Le Chef du Département des brevets

**Martine PLANCHE** 

DOCUMENT DE PRIORITÉ

PRÉSENTÉ OU TRANSMIS CONFORMÉMENT À LA RÈGLE 17.1.a) OU b)

INSTITUT
NATIONAL DE
LA PROPRIETE

31EGE 26 bis, rue de Saint-Petersbourg 75800 PARIS cedex 08 Téléphone : 33 (0)1 53 04 53 04 Télécopie : 33 (0)1 53 04 45 23 www.inpl.fr

September 1999

ETABLISSEMENT PUBLIC NATIONAL

1.0			
	,		
	•		



### **BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ**

Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

ANTIONAL DE LA PROPRIÈTE 26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

### REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 1/2

			Cet imprimé est à remplir lisit	olement à l'encre noire	DB 540 @ W / 2105
REMISE DES PIÈCES	Réservé à l'INPI				
75 INPI PARIS			À QUI LA CORRESPO	INDANCE DOIT ÊTRE ADR	ESSÉE .
MEA . A	0309212		PONTET ALLANO &		MANDEUR OU DU MANDATAIRE JANCE DOIT ÊTRE ADRESSÉE SOCIES SELARL NIVERSITE
N° D'ENREGISTREMENT			PARC CLUB ORSAY		
NATIONAL ATTRIBUÉ PAR L	20 1111 20	ากจ	25 Rue Jean Rostand F-91893 ORSAY CEI		
DATE DE DÉPÔT ATTRIBUÉS PAR L'INPI	E Z Q JUIL. LI	103	FRANCE	) LX	
Vos références po (facultatif) BS03			* '		¥
Confirmation d'un	n dépôt par télécopie		'I'INPI à la télécopie	A. Tomas Mar TV (2) Commenced	See a second a second
NATURE DE L	A DEMANDE	Cochez l'une des	4 cases suivantes		- 4
Demande de b	revet	X			
Demande de c	ertificat d'utilité	П			MANDATAIRE ADRESSÉE L  dispositifs  mé «Suite»
Demande divis	ionnaire			<del></del> -	
, L	Demande de brevet initiale	N°	Date		
,		N°	Date	1 1 1	]
	nde de certificat d'utilité initiale	N	Date		
	n d'une demande de en <i>Demande de brevet initiale</i>	N°	Date		1
	NVENTION (200 caractères ou	espaces maximum)			
1.4 3 3			ictifs supraconducteurs er	n couches minces, et di	spositifs
	els composants."		,		
·			*		
4 DÉCLARATIO	TO SPINOITÉ	Pays ou organisation	מה	. A.	
		Date 1 1	No No		-
	DU BÉNÉFICE DE	Pays ou organisation	on		
LA DATE DE I	DÉPÔT D'UNE	Date	N°	•	
DEMANDE AI	NTÉRIEURE FRANÇAISE	Pays ou organisation	on		
		Date	N°		
		☐ S'llyad'aı	utres priorités, cochez la c	ase et utilisez l'imprimé	«Suite»
5 DEMANDEUR	(Cochez l'une des 2 cases)	🔀 Personne r	norale Pe	rsonne physique	
Nom	the market and the water than the	CENTRE NATIO	NAL DE LA RECHERCH	E SCIENTIFIQUE	HARMINER, A DAY
9	òu dénomination sociale				
Prénoms	Prénoms		×		
Forme juridiqu	е	Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique			
N° SIREN					
Code APE-NAF					
Damiaila	Rue	3 rue Michel And	ge	-	- 8
Domicile ou					
siège	Code postal et ville	[7   5   7   9   4 ] PARIS Cedex 16			
	Pays	FRANCE			
Nationalité	anga pagagagang anga nganasanin atawa a pamba Piyayeee anga atawa anama adalah bendhasi nasi-nasan dabba be	Française			
N° de téléphor			N° de télécopie (fa	cultatif)	<del>,,</del>
Adresse électro	onique <i>(facultatif)</i>				
1		∐S'il yaplusd	un demandeur, cochez la c	case et utilisez l'imprimé	«Suite»



# BREVET D'INVENTION CERTIFICAT D'UTILITÉ

# REQUÊTE EN DÉLIVRANCE page 2/2



		Réservé à l'INPI				
REMISE	DESTRIÈCES []	1 2003				
DALE	75 INPI P	ARIŞ			•	
LIEU		0309212				
	IREGISTREMENT				DB 540 W / 210502	
	AL ATTRIBUÉ PAR L	and the second s				
G I	MANDATAIRE	(s'il y a lleu)			The second secon	
	lom					
	rénom		PONTET ALL AN	O & ASSOCIES SELAI	RL	
(	Cabinet ou Soc	ciété	FORTET ALLAN	O & 7,0000,20 022	_	
	V odo pouvoir	nermanent et/ou				
	N °de pouvoir permanent et/ou de lien contractuel					
			25 Rue Jean Rostand			
		Rue	PARC CLUB ORSAY UNIVERSITE			
1 '	Adresse	Code postal et ville	19 11 18 19 13 OF	SAY CEDEX		
		Pays	FRANCE			
	N° de télépho	ne (facultatif)	01 69 33 21 21			
	N° de télécopi	ie (facultatif)	01 69 41 95 88			
	Adresse électr	onique (facultatif)			and the second of the second o	
E	INVENTEUR	(S)	Les inventeurs s	ont nécessairement des	personnes physiques	
	l es demander	urs et les inventeurs	☐ Oui			
	sont les mêm	:			aire de Désignation d'inventeur(s)	
Ø	RAPPORT DI	E RECHERCHE	Uniquement pou	r une demande de breve	t (y compris division et transformation)	
		Établissement immédiat	X			
		ou établissement différé				
	Paiamant ách	elonné de la redevance	Uniquement pour les personnes physiques effectuant elles-mêmes leur propre dépôt  Oui  Non			
1		(en deux versements)				
	RÉDUCTION DU TAUX DES REDEVANCES		Uniquement pour les personnes physiques  Requise pour la première fois pour cette invention (joindre un avis de non-imposition)  Obtenue antérieurement à ce dépôt pour cette invention (joindre une copie de la décision d'admission à l'assistance gratuite ou indiquer sa référence): AG			
			0.00.07077 0.0707	3		
100	SÉQUENCES ET/OU D'AC	S DE NUCLEOTIDES IDES AMINÉS	Cochez la cas	e si la description contient	une liste de séquences	
	Le support él	ectronique de données est joint				
	La déclaratio	n de conformité de la liste de				
	séquences sur support papier avec le support électronique de données est jointe					
		z utilisé l'imprimé «Suite», nombre de pages jointes				
THE	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	DU DEMANDEUR			VISA DE LA PRÉFECTURE	
	OU DU MAR	NDATAIRE	. 1		OU DE L'INPI	
1	(Nom et qu	alité du signataire)	VI		L. MARIELLO	
		ALLANO 5/1/2003 03			L. MARIELLU	
1	3, , 00					
1					лания выправления при	

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

« Procédé et système de réalisation de composants inductifs supraconducteurs en couches minces, et dispositifs incluant de tels composants »

La présente invention concerne un procédé pour réaliser des composants inductifs supraconducteurs en couches minces. Elle vise également un système de réalisation mettant en œuvre ce procédé, ainsi que des dispositifs incluant de tels composants.

Cette invention s'inscrit dans le domaine des composants électriques et électroniques supraconducteurs pour les secteurs des télécommunications et de l'énergie électrique.

10

15

20

25

La réalisation de composants inductifs supraconducteurs en couches minces est généralement effectuée par dépôt d'un film supraconducteur, généralement par des méthodes de vide telles que la pulvérisation cathodique ou l'ablation laser pulsée, puis la définition par photo lithogravure de une ou plusieurs spires. Dans cette technique la dimension du dispositif croit avec la valeur de son inductance.

Un exemple pratique de réalisation consiste en une bobine comportant 5 spires dont le diamètre extérieur est de 15mm, avec des pistes de 0,4mm de largeur espacées de 0,3mm présentant une inductance de 2,12µH, qui est décrite dans le mémoire de thèse soutenu par Jean-Christophe Ginefri le 16 décembre 1999 à l'Université de Paris ΧI et surface supraconductrice « Antenne de miniature l'imagerie RMN à 1,5 Tesla ».

La technique décrite ci-dessus présente deux inconvénients principaux :

- 30 la surface occupée par chaque composant inductif est importante. Par exemple, le composant décrit au paragraphe précédent occupe une surface de plus de 700mm<sup>2</sup>:
  - si le composant est intégré dans un circuit, il est souvent nécessaire de raccorder l'extrémité de la spire intérieure à

une ligne supraconductrice. Ceci implique un processus complexe comportant après le dépôt et la gravure des spires :

a) le dépôt et la gravure d'un film isolant,

5

10

15

20

25

30

b) le dépôt et la gravure sur cet isolant d'un deuxième film supraconducteur présentant des propriétés similaires celles du premier film. Cette dernière étape délicate car il est nécessaire de particulièrement d'épitaxie, technique réaliser une reprise Il existe d'autres procédés difficilement maîtrisable. permettant de déposer une bobine en couches minces, mais ils présentent des difficultés de réalisation identiques à celles décrites ici.

Le but de la présente invention est de remédier à ces inconvénients en proposant un procédé de réalisation plus simple et moins coûteux que les procédés actuels.

Cet objectif est atteint avec un procédé de réalisation d'un composant inductif supraconducteur sous la forme de un ou plusieurs segments de ligne d'une surface de l'ordre de quelques centaines de microns carrés constitués d'un empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants.

On peut ainsi accéder à des processus de fabrication automatisables et collectifs mettant en œuvre des techniques connues et largement répandues de dépôt de couches minces et de gravure, ce qui contribue à une réduction sensible des coûts de fabrication.

Dans une forme de réalisation préférée de l'invention, chaque film constituant l'empilement est parfaitement cristallisé. Le dispositif est dimensionné de façon à ce que dans les conditions de travail il se trouve dans l'état Meissner, c'est à dire l'état dans lequel il ne présente pas de dissipation mesurable en courant continu.

Le dispositif proposé peut être réalisé à partir de tout couple de matériaux permettant de réaliser un empilement de

films alternativement supraconducteurs et isolants en dessous d'une température appelée température critique. Plusieurs processus peuvent être envisagés pour la fabrication de circuits supraconducteurs intégrant l'invention.

Un premier processus de fabrication comprend les étapes suivantes :

1) dépôt d'un film supraconducteur

5

10

20

25

30

- 2) dépôt de l'empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants
- 3) gravure de l'ensemble des films déposés
  - 4) gravure sélective de l'empilement réalisé de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.

Un second processus de fabrication peut aussi être mis 15 en œuvre avec les étapes suivantes :

- 1) dépôt d'un film supraconducteur
- 2) dépôt de l'empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants
- 3) gravure sélective de l'empilement réalisé de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.
  - 4) gravure du reste du circuit

Un troisième processus possible comprend les étapes suivants :

- 1) dépôt d'un film supraconducteur
- 2) gravure du film supraconducteur
- 3) dépôt de l'empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants
- 4) gravure sélective de l'empilement réalisé de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.

Un quatrième processus possible comprend les étapes suivantes:

- 3 -

films alternativement supraconducteurs et isolants en dessous d'une température appelée température critique. Plusieurs processus peuvent être envisagés pour la fabrication de circuits supraconducteurs intégrant l'invention.

- 5 Un premier processus de fabrication comprend les étapes suivantes:
  - 1) dépôt d'un film supraconducteur
  - 2) dépôt de l'empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants
- 3) gravure de l'ensemble des films déposés, par exemple sous la forme d'une gravure simultanée de l'empilement et du film supraconducteur,
  - 4) gravure sélective de l'empilement réalisé de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.

Un second processus de fabrication peut aussi être mis en œuvre avec les étapes suivantes :

1) dépôt d'un film supraconducteur

15

20

30

- 2) dépôt de l'empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants
- 3) gravure sélective de l'empilement réalisé de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.
- 4) gravure du reste du circuit
- 25 Un troisième processus possible comprend les étapes suivants:
  - 1) dépôt d'un film supraconducteur
  - 2) gravure du film supraconducteur
  - 3) dépôt de l'empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants
  - 4) gravure sélective de l'empilement réalisé de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.

Un quatrième processus possible comprend les étapes suivantes:

- 1) dépôt de l'empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants
- 2) gravure sélective de l'empilement réalisé de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.
- 3) raccordement des composants inductifs ainsi réalisés au reste du circuit par des connections supraconductrices ou non.

Suivant un autre aspect de l'invention, il est proposé 10 un système pour réaliser un composant inductif supraconducteur sous la forme d'un ou plusieurs segments de ligne constitués d'un empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants, mettant en œuvre le procédé selon l'invention.

5

25

- Dans une forme particulière de l'invention, ce système de réalisation comprend :
  - des moyens pour déposer un film supraconducteur sur un substrat,
- des moyens pour déposer sur le film supraconducteur un 20 empilement de films alternativement supraconducteurs et isolants, et
  - des moyens pour graver l'ensemble des films déposés, ces moyens étant agencés de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.

Suivant encore un autre aspect de l'invention, il est proposé un dispositif d'antenne comprenant un circuit électronique incluant un composant inductif supraconducteur réalisé par le procédé selon l'invention.

Toujours dans le cadre de la présente invention, il est proposé un dispositif de ligne à retard comportant un composant inductif en série et un composant capacitif en aval dudit composant inductif, caractérisé en ce que le composant

5

30

inductif est un composant inductif supraconducteur réalisé par le procédé selon l'invention.

Des lignes à retard selon l'invention peuvent être mises en œuvre dans un dispositif radar à décalage de phase comportant une pluralité d'antennes comprenant chacune un circuit électronique incluant une ligne à retard selon l'invention, cette ligne à retard étant agencée de sorte que chacune desdites antennes émet un signal dont la phase est décalée par rapport à celle des antennes voisines.

D'autres avantages et caractéristiques de l'invention apparaîtront à l'examen de la description détaillée d'un mode de mise en œuvre nullement limitatif, et des dessins annexés sur lesquels :

- la figure 1 est un schéma d'un empilement E de couches  $C_1$  et  $C_2$  déposées sur un substrat ;
  - la figure 2A est une vue de dessus d'une ligne supraconductrice LS comportant un composant inductif constitué de films alternativement supraconducteurs C1 et isolants C2;
- 20 la figure 2B est une vue en coupe d'une ligne supraconductrice LS comportant un composant inductif E constitué de films alternativement supraconducteurs C1 et isolants C2;
- la figure 3A est une photographie du motif utilisé 25 pour les tests montrant l'emplacement des entrées de courant Il et I2, les plots de mesure V1 et V2 de la différence de potentiel aux bornes du pont ainsi que l'emplacement de celui-ci;
  - la figure 3B représente le masque de photolithogravure utilisé pour réaliser le motif de test de la figure 3A;
  - La figure 4 est un schéma du dispositif de mesure utilisé pour caractériser un composant inductif supraconducteur selon l'invention;

- la figure 5 illustre une différence de potentiel mesurée entre les plots V1 et V2 (traits pleins) lorsque un courant en dents de scie à la fréquence de 700Hz (pointillés) circule dans l'échantillon;
- la figure 6 représente une comparaison des différences de potentiel mesurées entre les plots V1 et V2 lorsque deux courants en dents de scie de même amplitude Imax =10 microampères mais de fréquences différentes circulent dans l'échantillon;
- 10 la figure 7 illustre une ligne de retard implémentant un composant inductif supraconducteur selon l'invention ; et

15

20

- la figure 8 schéma de principe d'une antenne à décalage de phase.

Le principe mis en œuvre dans le procédé de réalisation selon l'invention réside en un empilement E de films minces alternativement supraconducteurs C1 et isolants C2 déposés sur un substrat S, en référence à la figure 1, ou bien sur une ligne supraconductrice LS. Il est déterminant que les films C2 soient rigoureusement isolants et que des défauts de croissance ne mettent pas deux films supraconducteurs voisins en contact.

Dans une forme de réalisation préférée de l'invention, le premier film déposé pour réaliser l'empilement E est isolant comme indiqué sur la figure 1.

L'intégration de composants inductifs dans un circuit supraconducteur peut être effectuée de la façon indiquée sur les figures 2A et 2B en utilisant les techniques de dépôt de films minces bien connues de l'homme de l'art, par exemple l'ablation laser, la pulvérisation cathodique radiofréquence, l'évaporation sous vide, le dépôt chimique en phase vapeur et de manière générale toute technique de dépôt permettant l'obtention de couches minces.

Il est à noter que dans cette version particulière du procédé selon l'invention correspondant aux figures 2A et 2B,

un film supraconducteur L1 déposé sur un substrat S, une fois gravé, constitue une ligne supraconductrice LS sur laquelle sera placé l'empilement inductif E.

un exemple particulier de réalisation l'invention fourni à titre non limitatif, les matériaux sont les composés YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-δ</sub> pour les films choisis supraconducteurs et LaAlO3 pour les films isolants.  $(10^{-8}m)$ pour les 10nm de sont épaisseurs supraconducteurs et de 4nm ( $4.10^{-9}m$ ) pour les films isolants. 14 paires de films ont été déposées.

5

10

15

20

25

30

Après dépôt, les films ont été gravés de façon à obtenir le motif représenté sur la figure 3A dans laquelle on distingue les contacts métallisés II, I2 qui permettent d'amener le courant dans l'échantillon et ceux qui permettent de mesurer les tensions V1 et V2 aux bornes de l'élément central, appelé pont, du motif. A titre indicatif et non limitatif, la taille du pont est de 10μm x 20μm.

Le dispositif de mesure utilisé pour caractériser les échantillons de composants inductifs supraconducteurs selon l'invention, représenté en figure 4, comporte un générateur GBF créant un courant variable dans le temps I(t) traverse la résistance R et l'échantillon Ech via contacts I1 et I2. La différence de potentiel aux bornes de amplificateur amplifiée par un est R résistance la envoyée une entrée sur différentiel et ΑI l'oscilloscope Osc. Elle permet de connaître l'intensité I(t) courant traversant l'échantillon. La différence potentiel aux bornes de l'échantillon est prélevée en V1 et V2, amplifiée par l'amplificateur Av et envoyée sur l'entrée Yv de l'oscilloscope Osc.

La figure 5 montre les signaux recueillis en YI et Yv lorsque l'échantillon est à une température de 70K. Dans le cas présent, l'échantillon était placé dans un cryostat à hélium liquide, mais tout procédé permettant d'obtenir une

5

10

15

20

25

30

température inférieure à la température critique de l'échantillon étudié convient.

Le générateur délivre un courant en dents de scie à la fréquence de 700Hz. On a directement reporté la valeur du courant İ(t). On observe que la différence de potentiel V(t) entre V1 et V2 présente la forme de créneaux, ce qui indique que V(t) est proportionnelle à la dérivée par rapport au de I(t). Cette caractéristique que l'échantillon se comporte bien comme un composant inductif. On a reporté sur la figure 6 les signaux V(t) mesurés à 700 Hz et 2kHz pour une valeur du courant crête égale à 10 uA les deux cas. Dans cette figure, le trait la tension relevée pour un courant correspond à fréquence F=700Hz et le trait pointillé à celle relevée pour un courant à la fréquence F=2000Hz.

On observe que le rapport de l'amplitude des signaux obtenus est dans le rapport des fréquences appliquées, ce qui là aussi est typique d'un composant inductif.

Des résultats présentés sur la figure 6, on déduit que l'inductance du composant réalisé selon l'invention est égale à 535 µH ± 10µH. Les composants testés n'ont pas tous présenté une inductance aussi élevée mais des valeurs de l'ordre de quelques dizaines de µH ont été couramment obtenues avec des composants de forme identique à celui présenté ici.

Les composants inductifs supraconducteurs obtenus par le procédé selon l'invention peuvent trouver des applications dans les domaines de l'électrotechnique, des antennes et des composants passifs à haute fréquence, en particulier pour les radars et l'électronique de défense.

Dans un premier exemple d'application, des composants inductifs supraconducteurs sont implémentés dans des systèmes d'antennes. Ainsi, dans un certain nombre de cas, par exemple en imagerie médicale par résonance magnétique (IRM) de

surface, on utilise des antennes accordées. Un paramètre important intervenant dans l'efficacité de l'antenne est le coefficient de surtension qui est proportionnel à son inductance. Une antenne supraconductrice permet de faire croître ce coefficient car sa résistance ohmique est très faible. On peut penser obtenir un nouvel accroissement du coefficient de surtension en incluant dans le circuit d'antenne un dispositif du type de ceux décrits ici

5

15

20

25

30

Un cas particulièrement favorable sera celui ou 10 l'antenne elle-même est réalisée à partir d'un film mince supraconducteur.

Dans un autre exemple d'application, des composants inductifs supraconducteurs sont mis en œuvre dans des lignes à retard. Les lignes à retard sont d'usage courant dans tous les domaines de l'électronique. La forme la plus simple que peut prendre une ligne à retard est représentée sur la figure 7.

La présence dans le circuit de l'inductance L et condensateur C provoque une différence de phase entre tension V et le courant I. Un exemple d'utilisation est celui des radars à décalage de phase qui permettent d'explorer l'espace environnant avec un système d'antennes fixes. schéma de principe pour un tel système est reporté sur la figure 8. Dans ce dispositif la ligne principale portant le courant I est couplé aux différentes antennes. Chacune de celles-ci comporte dans son circuit une ligne à retard. Il en résulte que chaque antenne émet un signal dont la phase est décalée par rapport à celle des antennes voisines. En faisant varier ce décalage de phase on change la direction du rayonnement émis. En électronique de défense, on étudie l'introduction de composants depuis longtemps circuits électroniques, supraconducteurs dans les particulier pour les radars et plus généralement les contremesures. La présence de composants à forte inductance,

petites dimensions et dont la fabrication utilise des processus similaires à ceux employés pour le reste du circuit serait une innovation importante dans ce domaine.

5

10

15

Bien sûr, l'invention n'est pas limitée aux exemples qui viennent d'être décrits et de nombreux aménagements peuvent apportés à ces exemples sans sortir du cadre de l'invention. Ainsi, le nombre de films respectivement isolants et supraconducteurs n'est pas limités aux exemples Par ailleurs, les dimensions des composants inductifs supraconducteurs ainsi que leurs surfaces peuvent évoluer en fonction des applications spécifiques de ces composants. De plus, les films respectivement supraconducteurs et isolants peuvent être réalisés à partir d'autres composés que ceux proposés dans l'exemple décrit, pourvu que ces composés satisfassent aux conditions physiques requises pour les applications.

### REVENDICATIONS

1. Procédé pour réaliser un composant inductif supraconducteur, sous la forme d'un ou plusieurs segments de ligne constitués d'un empilement (E) de films alternativement supraconducteurs (C1) et isolants (C2).

5

15

- Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce que chaque film constituant l'empilement (E) est parfaitement
   cristallisé.
  - 3. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend une première étape de dépôt d'un film isolant (C2) sur un substrat (S).
  - 4. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend une première étape de dépôt d'un film supraconducteur (C1) sur un substrat (S).
- 5. Procédé selon l'une des revendications 1 ou 2, caractérisé en ce qu'il comprend une première étape de dépôt d'un film supraconducteur (L1) sur un substrat (S) suivi du dépôt de l'empilement (E).
- 25 6. Procédé selon l'une des revendications 3 ou 4, caractérisé en ce qu'il comprend en outre les étapes suivantes :
  - un dépôt de l'empilement (E) de films alternativement supraconducteurs (C1) et isolants (C2),
- une gravure de l'empilement (E) réalisé de façon à ne 30 laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.
  - 7. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comprend en outre les étapes suivantes :

- une gravure de l'empilement (E) réalisé de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.
  - une gravure du film supraconducteur (L1).

5

25

- 8. Procédé selon la revendication 5, caractérisé en ce qu'il comprend en outre les étapes suivantes :
- une gravure simultanée de l'empilement (E) et du film supraconducteur (L1)
- une gravure de l'empilement (E) réalisé de façon à ne laisser subsister celui-ci qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.
- 9. Procédé selon l'une des revendications précédentes,
  15 caractérisé en ce que les films supraconducteurs (C1) sont réalisés à partir de composés YBa<sub>2</sub>Cu<sub>3</sub>O<sub>7-8</sub>.
- 10. Procédé selon l'une des revendications précédentes, caractérisé en ce que les films isolants (C2) sont réalisés à partir de composés LaAlO3.
  - 11. Système pour réaliser un composant inductif supraconducteur sous la forme d'un ou plusieurs segments de ligne constitués d'un empilement (E) de films alternativement supraconducteurs (C1) et isolants (C2), mettant en œuvre le procédé selon l'une des revendications précédentes.
  - 12. Système selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comprend:
- 30 des moyens pour déposer un empilement (E) de films alternativement supraconducteurs et isolants, et
  - des moyens pour graver l'ensemble des films déposés, ces moyens étant agencés de façon à ne laisser subsister lesdits

films déposés qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.

13. Système selon la revendication 11, caractérisé en ce qu'il comprend:

5

10

15

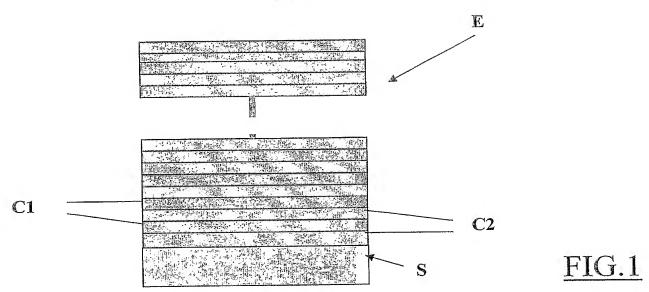
20

30

- des moyens pour déposer un film supraconducteur (L1) sur un substrat (S),
- des moyens pour déposer sur le film supraconducteur (L1) un empilement (E) de films alternativement supraconducteurs et isolants, et
- des moyens pour graver l'ensemble des films déposés, ces moyens étant agencés de façon à ne laisser subsister le film (L1) qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter une ligne supraconductrice et l'empilement (E) qu'aux emplacements où l'on souhaite implanter un composant inductif.
- 14. Dispositif d'antenne comprenant un circuit électronique incluant un composant inductif supraconducteur réalisé par le procédé selon l'une des revendications 1 à 10.
- 15. Dispositif d'antenne selon la revendication 14, caractérisé en ce que l'antenne est réalisée à partir d'un film mince supraconducteur.
- 25 16. Dispositif de ligne à retard comportant en série un composant inductif et un composant capacitif en aval dudit composant inductif, caractérisé en ce que le composant inductif est un composant inductif supraconducteur réalisé par le procédé selon l'une des revendications 1 à 10.
  - 17. Dispositif radar à décalage de phase comportant une pluralité d'antennes comprenant chacune un circuit électronique incluant une ligne à retard selon la revendication 16, cette ligne à retard étant agencée de sorte

que chacune desdites antennes émet un signal dont la phase est décalée par rapport à celle des antennes voisines.





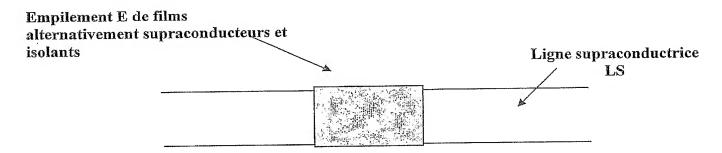


FIG.2A

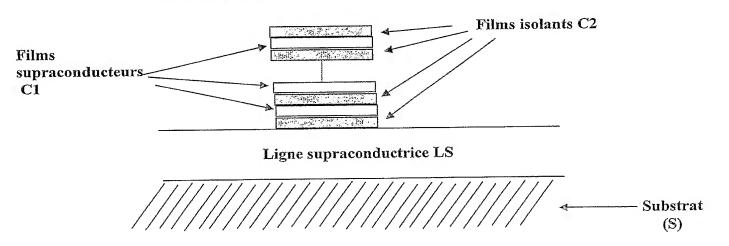


FIG.2B

# 2/5

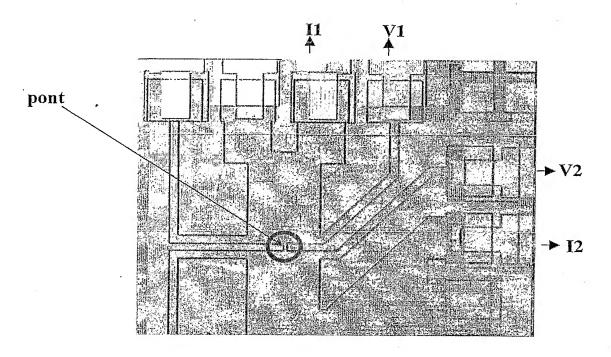


FIG.3A

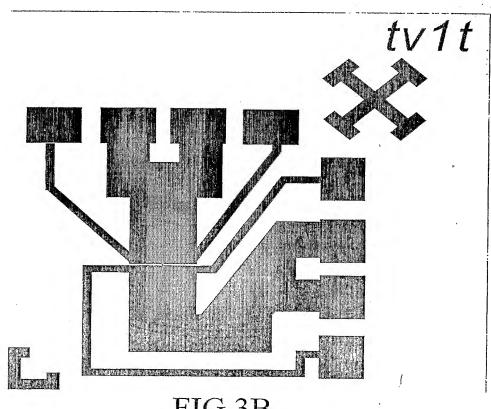


FIG.3B

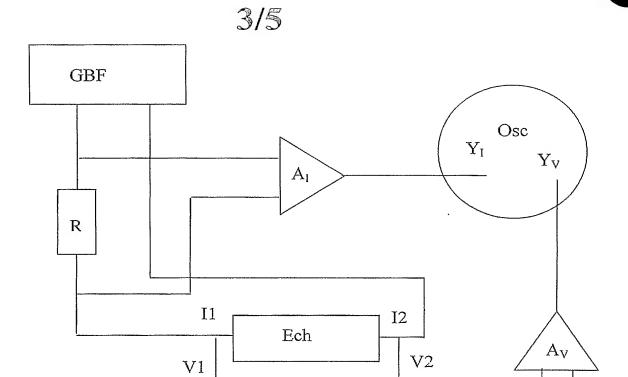


FIG.4

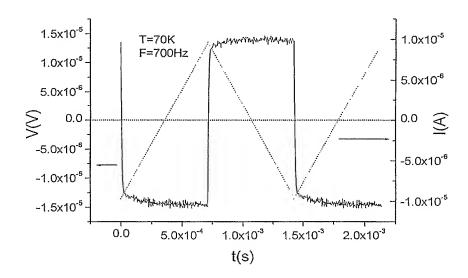


FIG.5

# 4/5

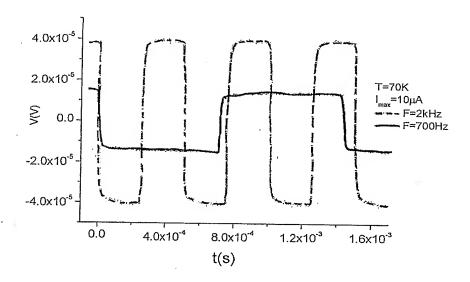


FIG.6

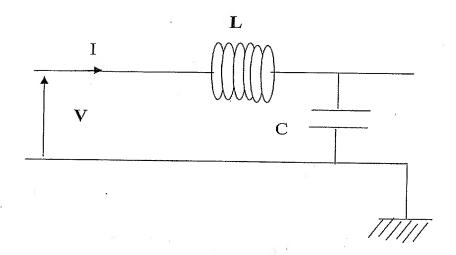


FIG.7

# 5/5

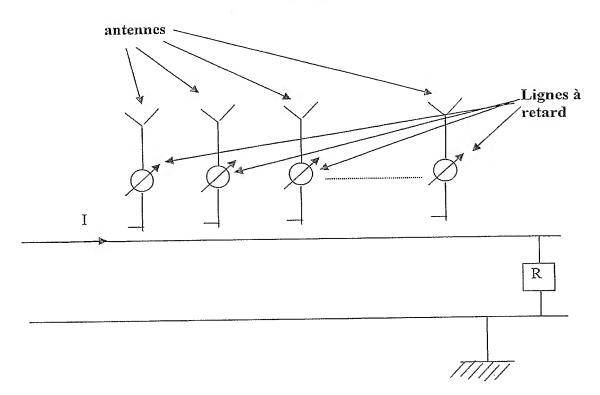


FIG.8



### **BREVET D'INVENTION**

### **CERTIFICAT D'UTILITÉ**



Code de la propriété intellectuelle - Livre VI

#### DÉPARTEMENT DES BREVETS

.26 bis, rue de Saint Pétersbourg 75800 Paris Cedex 08 Téléphone : 33 (1) 53 04 53 04 Télécopie : 33 (1) 42 94 86 54

### **DÉSIGNATION D'INVENTEUR(S)** Page N° 1../1..

INV

(À fournir dans le cas où les demandeurs et les inventeurs ne sont pas les mêmes personnes)

Cet imprimé est à remplir lisiblement à l'encre noire

DB 113 @ W / 270601

Vos références pour ce dossier (facultatif)	BS03 CNR IND	
N° D'ENREGISTREMENT NATIONAL	03 09212	

#### TITRE DE L'INVENTION (200 caractères ou espaces maximum)

"Procédé et système de réalisation de composants inductifs supraconducteurs en couches minces, et dispositifs incluant de tels composants."

### LE(S) DEMANDEUR(S):

CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Etablissement Public à Caractère Scientifique et Technologique 3 rue Michel Ange F-75794 PARIS CEDEX 16 France

#### DESIGNE(NT) EN TANT QU'INVENTEUR(S):

Nom		BERNSTEIN	
Prénoms		Pierre-Ernest	
Adresse	Rue	2, rue de l'Eglise	
	Code postal et ville	[1,4,4,8,0] VILLIERS-LE-SEC	
Société d'a	appartenance (facultatif)		
Nom		HAMET	
Prénoms		Jean-François, Maurice	
Adresse	Rue	15, rue du Parc	
	Code postal et ville	[1,4,6,1,0] ANGUERNY	
Société d'appartenance (facultatif)			
Nom		TOUITOU	
Prénoms		Nabil	
Adresse	Rue	32, rue de la Plaine	
•	Code postal et ville	3  8  6  1  0   GIERES	
Société d'a	ppartenance (facultatif)	- I resident in the second in	

S'il y a plus de trois inventeurs, utilisez plusieurs formulaires. Indiquez en haut à droite le N° de la page suivi du nombre de pages.

DATE ET SIGNATURE(S)
DU (DES) DEMANDEUR(S)
OU DU MANDATAIRE
(Nom et qualité du signataire)

Orsay, le 28 Juillet 2003 Sylvain ALLANO

CPI 96 03 03

re)

La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux réponses faites à ce formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour les données vous concernant auprès de l'INPI.

PCT/FR20**04**/00**1873**